

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17410-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 04.12.2025

Ausstellungsdatum: 04.12.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-17410-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

**WIN Messmittel und Service GmbH
Wiesenring 33, 07554 Korbußen**

mit dem Standort

**WIN Messmittel und Service GmbH
Wiesenring 33
07554 Korbußen**

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17410-01-01

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle Messgrößen
Länge

- Parallelendmaße
- Längenmessmittel
- Durchmesser
- Formabweichung
- Gewinde

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Länge				
Parallelendmaße aus Stahl nach DIN EN ISO 3650:1999	0,5 mm bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 3.1:2004 Messung der Abweichung des Mittenmaßes l_c vom Nennmaß l_n durch Unter- schiedsmessung	Für das Mittenmaß: $0,1 \mu\text{m} + 1 \cdot 10^{-6} \cdot l$ Für die Abweichungen f_o und f_u vom Mittenmaß: $0,07 \mu\text{m}$	l = Länge des Maßes in den Nennmaßen der Normale Messflächenqualität entsprechend den Festlegungen im QMH bzw. in den Arbeitsan- weisungen
Parallelendmaße aus Keramik und Wolfram- carbid nach DIN EN ISO 3650:1999	0,5 mm bis 100 mm	Messung der Abwei- chungen f_o und f_u vom Mittenmaß durch 5-Punkte-Unterschieds- messung	Für das Mittenmaß: $0,12 \mu\text{m} + 1 \cdot 10^{-6} \cdot l$ Für die Abweichungen f_o und f_u vom Mittenmaß: $0,07 \mu\text{m}$	Für die kleinsten Mess- unsicherheiten sind Anschiebbarkeit und Anschubmerkmale beider Messflächen des Kalibriergegenstands mit einer geeigneten Planglasplatte zu prüfen.
Parallelendmaße aus Stahl nach DIN EN ISO 3650:1999	> 100 mm bis 1500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 3.1:2004 in den Nennmaßen, die von denen der Normale max. 500 mm abweichen. Messung der Abweichung des Mittenmaßes l_c vom Nennmaß l_n durch Unterschiedsmessung	Für das Mittenmaß: $0,3 \mu\text{m} + 1,3 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Messuhren mit Skalenanzeige	bis 12,5 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.1:2021	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge
Messuhren mit Ziffernanzeige	bis 12,5 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.4:2020	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Feinzeiger	bis 3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.2:2002	$0,7 \mu\text{m}$	
Fühlhebelmessgeräte	bis 1,6 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.3:2002	$1,2 \mu\text{m}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17410-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße	0 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006	$30 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge
Tiefenmessschieber	0 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.2:2006	$30 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Höhenmessschieber	0 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.3:2006	$30 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Einstellmaße für Bügelmessschrauben	25 mm bis 500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.4:2009	$0,3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Rachenlehren	3 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.7:2005	$0,8 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Bügelmessschrauben	0 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge
Feinzeigermess- schrauben	0 mm bis 150 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.3:2002	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung	20 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.7:2010	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge
Innenmessschrauben mit 3-Linien-Berührung	3 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.8:2002	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Lehrringe Durchmesser	5 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 3 und 4	$0,8 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	d = gemessener Durchmesser
Rundheitsabweichung	bis 40 μm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 1 und 2	0,4 μm	
Parallelitätsabweichung und Geradheitsabwei- chung	bis 40 μm		0,8 μm	
Lehrdorne Durchmesser	3 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 3 und 4	$0,8 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Rundheitsabweichung	bis 40 μm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 1 und 2	0,4 μm	
Parallelitätsabweichung und Geradheitsabwei- chung	bis 40 μm		0,8 μm	
Prüfzylinder, Prüfdorne Durchmesser	3 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.6:2014	$0,8 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Rundheitsabweichung	bis 40 μm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.6:2014	0,4 μm	
Parallelitätsabweichung und Geradheitsabwei- chung	bis 40 μm		0,8 μm	

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Prüfstifte / Gewindeprüfstifte Durchmesser	3 mm bis 20 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2007 Option 1	$0,8 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	d = gemessener Durchmesser
Rundheitsabweichung	bis 40 μm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2007 Option 2	0,4 μm	
Gewindelehren (eingängige zylindrische Außen- und Innenge- winde mit geradlinigen Flanken und symmetri- schem Profil)				
Außengewinde Einfacher Flankendurch- messer mit Nennsteigung $\geq 0,25 \text{ mm}$	1 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006 Option 1	$3,5 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	d = gemessener Durchmesser Einfacher Flanken- durchmesser (simple pitch diameter)
Innengewinde Einfacher Flankendurch- messer mit Nennsteigung 0,5 mm bis 6,0 mm	5 mm bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006 Option 1	$3,5 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	

Verwendete Abkürzungen:

CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DGQ	Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DKD	Deutscher Kalibrierdienst
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.
VDI	Verein Deutscher Ingenieure e.V.